การหาความเค้นบริเวณร่องขนาดเล็กในแผนวัสดุโดยวิธีโฟโตอีลาสติก

นายอภิวันท์ พลซัย



006356

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521

STRESS CONCENTRATION AROUND A SLIT IN AN INFINITE PLATE BY PHOTOELASTIC METHOD

Mr. Apiwon Polchai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Mechanical Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1978

Thesis Title Stress Concentration Around a Slit in an Infinite Plate by Photoelastic Method By Mr. Apiwon Polchai Department Mechanical Engineering Thesis Adviser Assc. Prof. Dr. Pinai Sukhawarn Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in Partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree S. Bunnag Acting Dean of Graduate School (Asst. Prof. Supradit Bunnag, Ph.D.) Thesis Committee: (Asst. Prof. Variddhi Ungphakorn, Ph.D.) Pmai Cukhavaru. Member (Assc. Prof. Pinai Sukhawarn, Ph.D.) Harut Sutabuty Member (Assc. Prof. Harit Sutabutr, Ph.D.) l. Pan_ye......Member (Asst. Prof. Ittipol Pan-ngam, Ph.D.) Kalet Brill. Member

Copyright of the Graduate School, Chulalongkorn University

(Dr. Kaukeart Boonchukosol, Dr. Ing.)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การหาความเค้นบริเวณรองขนาดเล็กในแผ่นวัสดุโดยวิธี

โฟโตอีลาสติก

ชื่อนิสิท นายอภิวันท์ พลซัย

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. คร. พินัย สุขวรรณ

แผนกวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

ปีการศึกษา 2521



บทคัดยอ

การศึกษานี้ใช้วิธีโฟโตอีลาสติกหาคาความเค้นเข้มข้น (stress concentration factor) รอบรองขนาดเล็กบนแผนวัสดุใสซึ่งมีแรงภายนอกแบบกระจายกระทำใน แนวเดียวแต่ที่สหางตรงกันข้าม ได้ให้ความสนใจกับรองซึ่งมีความกว้างเป็นสองเทาของ รัศมีความโค้งที่ปลายและหดลองโดยการเปลี่ยนแปรขนาดและเปลี่ยนแปรตำแหน่งเอียง ของรองตาง ๆ กัน และใช้ผลการหดลองเป็นแนวทางในการปรุงแต่งสมการของคาความเค้น เข้มข้นที่ปลายของรูแบบเอลลิพส์ (elliptic hole) มาใช้กับรองแบบที่กลาวแล้ว ซึ่ง พบว่า คาความเค้นเข้มข้นของรองแบบนี้สามารถคำนวณได้จาก

 $[(2m + 12)/\sqrt{3m + 16}] - [(m/12)\cos 2\beta]$

เมื่อ m เป็นอัตราส่วนของครึ่งหนึ่งของความยาวระหวางจุดโฟกัสตอรัศมีความโค้งที่ปลาย ของรอง และ ฿ เป็นมุมเอียงที่แนวของรองกระทำกับแนวของแรงแผกระจายที่กระทำ กับแผนวัสดุ ถึงแม้วานิพจน์ข้างบนจะได้มาโดยถือเอาผลจากการหดลองเป็นหลักแต่ปรากฏ วาที่ m มีคาสูง และ ฿ มีคาตำ เซนเมื่อ m เทากับ 24 และ ฿ เทากับ 30 องศา คาความเค้นเข้มข้นที่คำนวณได้จะน้อยกวาคาที่ได้จากการหดลองประมาณ 10 เปอร์เซนต์

นอกจากนี้การพคลองยังทำเฉพาะที่ m เท่ากับ 16 แต่เปลี่ยนความยาวและ รัศมีความโค้งที่ปลายของรองแบบที่กลาวแล้ว และเอาผลมาเปรียบเทียบกับของรองแคบ Thesis Title Stress Concentration Around a Slit in an

Infinite Plate by Photoelastic Method

Name Mr. Apiwon Polchai

Thesis Adviser Assc. Prof. Dr. Pinai Sukhawarn

Department Mechanical Engineering

Academic Year 1978

ABSTRACT

In this study, the photoelastic method is employed to find the stress concentration factor around a slit centrally placed in an infinite transparent plate loaded by uni-directional uniformly distributed forces. The interest is concentrated on the parallel - side slit with semi - circular ends, and the experiment is done at various sizes of slit and at various inclination angles. The results obtained from the experiment are used as a guide line in modifying the equation of a stress concentration factor at the end of an elliptic hole to be adopted for the case of the parallel - side slit. It is found that the stress concentration factor of the parallel - side slit can be given by

$$[(2m + 12)/\sqrt{3m + 16}] - [(m/12)\cos 2]$$

where m is the ratio of the semi - focal length to the end radius of curvature and β is the inclination angle of the slit with

respect to the direction of the uniformly distributed load.

Although, the above expression bases upon the experimental results, at high m and low \$\beta\$ such as m equal to 24 and \$\beta\$ equal to 30 degrees the stress concentration factor calculated by the above expression is 10 percents lower than that of the experiment.

Besides, the experiment is conducted at m equal to 16 for different lengths and different end radii of curvature of the slit. The stress concentration factor for this case is compared to that of a narrow slit, and at m equal to 16 it is found that, at the same \$\beta\$, the stress concentration factors of both slits are considered to be equal.

ACKNOWLEDGEMENT

The author is greatly indebted to Dr. Pinai Sukhawarn for the supervision, the correction of English and many helpful discussions during the course of this work. He also wishes to thank Mr. Chinatep Benyajati for the lending of his camera without which this work cannot be completed.

The author is also very grateful to the Graduate School, Chulalongkorn University for the partial sponsorship.

TABLE OF CONTENTS

Chapter	Title		Page
	Title Page		 . i
	Thesis Approval		 . iii
	Abstract		 . vi
	Acknowledgement		 . viii
	Table of Contents		 . ix
	List of Tables		 . ×
	List of Figures		 . xi
	List of Symbols		 . xv
I	Introduction		 . 1
II	Photoelastic Theory		 . 9
III	Stress Concentration Around Elliptic	Holes	 . 27
IA	Experimental Method		 . 35
V	Results		 . 50
VI	Discussion of Results		 . 64
VII	Conclusions		 . 7
VIII	Suggestion For Further Work		 . 73
	Appendix		 . 75
	Figures		 . 79
	References		 . 126
	Vita		 . 128

LIST OF TABLES

Table		Page
4-1	Dimensions of Test Specimens	39
4-2	Load and Fringe Order of Calibrated Specimen	45
5-1	Stress Concentration Factors (K_F) of Slits	50
5-2	Comparison of Experimental and Calculated Stress	
	Concentration Factors at & equal to 45 degrees .	53
5-3	Comparison of Experimental and Calculated Stress	
	Concentration Factors at Different \$	54
5-4	Comparison of Stress Concentration Factors of	
	Slit (a), (b) and (c) at c/r equal to 16	55
A1	Load Applied to the Test Specimen which Gives a	
	Maximum Isochromatic Fringe Order of 4.5 on its	
	Slit's Edge	77

LIST OF FIGURES

Figure		Page
1-1	Stress Concentration Factor Plotted Against the	ı.
	Ratio of c/r, Presented by Cox	L _t
1-2	Stress Concentration Factor of a Rounded-End	
	Rectangular Hole Plotted Against c/r where a' = r	6
2-1	Light Through a Plane Polariscope	12
2-2	Standard Circular Polariscope	23
2-3	Action of a Quarter Wave Plate Upon one Light	
	Ray	25
3-1	Elliptic Hole in Uniformly Stressed Plate	28
3-2	Stress Concentration Factor of a Transverse	
	Elliptic Hole	30
4-1	Nominal Size of test Specimen	37
4-2	Enlarged View of Slits	38
4-3	Specimen for Calibration	43
4-4	Loading Diagram of test Specimen	47
5-1	Stress Concentration Factor of a Parallel-Side	
	Slit Plotted Against c/r at Constant Angle of	
	Inclination	57
5-2	Stress Concentration Factor of a Parallel-Side	
	Slit Plotted Against Angle of Inclination & at	
	Constant c/r	58

igure		Page
5-3	Stress Concentration Factors of type I and type II	
	Slits Plotted Against Angle of Inclination at c/r	
	= 16	59
5-4	Stress Concentration Factor Plotted Against Angle	
	of Inclination at Constant c/r	60
5 - 5	Comparison Between the Result of Previous Studies	
	and the Result from the Experiment at Angle of	
	Inclination $\beta = 90^{\circ}$	61
5-6	Stress Concentration Factor Plotted Against Angle	
	of Inclination at Constant c/r	62
5 - 7	Show Point of Maximum Stress	63
A1	Calibration Curve for epoxy resin Sheet in Tension	
	Using Yellow Light Traversing the Thickness of	
	3.2 mm	79
A 2	Isochromatic Band of Specimen for Calibration at	
A2	Fringe Order = 0.5	80
. 7		
A3	Isochromatic Band of Specimen for Calibration at	81
	Fringe Order = 1.0	J.
A4	Isochromatic Band of Specimen for Calibration at	82
	Fringe Order = 3.0	02
A5	Isochromatic Band of Specimen for Calibration at	
	Fringe Order = 4.5	83
A6	Isochromatic Band of Specimen for Calibration at	
	Fringe Order = 7.0	84

Figure	,											Page
A7	Isochromatic	Band of	Spe	ecimen for	· Cal	ibi	rat	ti	on	a	t	
	Fringe Order							0			٥	85
A.8	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	1		•		0		86
A9	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	2	0		٥		•	87
A10	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	3						88
A11	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	4						89
A12	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	5	•	0	•			90
A13	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	6		•	0			91
A14	Isochromatic											92
A15	Isochromatic											93
A16	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	9		0				94
A17	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	10		•				95
A18	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	11					•	96
Á19	Isochromatic										۰	97
A20	Isochromatic											98
A21	Isochromatic										٠	99
	Isochromatic					15					٠	100
A22	Isochromatic							•			Ĭ	101
A23	Isochromatic							Ů			Ĭ	102
A24								•	•	۰	•	103
A25	Isochromatic							0	٠	•	•	104
A26	Isochromatic							•	٥	٠	۰	
A27	Isochromatic							•	•	•	o	105
A28	Isochromatic							•	•	•	۰	106
A29	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	22		0	•		۰	107

Figure												Page
A30	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	23	•	٥	•	•	•	108
A31	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	24	•					109
A32	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	25						110
A33	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	26	٠	•		•		. 111
A34	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	27	•		•			112
A35	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	28						113
A36	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	29				•	0	114
A37	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	30						115
A38	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	31						116
A39	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	32						117
A40	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	33	•					118
A41	Isochromatic	Pattern	of	Specimen	no.	34						119
A42	Standard Cir	cular Po	lar	iscope wi	th S	cre	en					120
A43	Typical Stan	dard Pola	ari	scope .						•		121
A44	A View of Lo	ading Fra	ame						•		•	122
A45	Test Specime	n with L:	ink	s				`.		•		123
A46	Specimen for	Calibra	tio	n Under L	oad		•					124
A47	Specimen Und	er Load										125

LIST OF SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION	UNIT
a	semi-major axis of an elliptic hole	mm
a'	width of a rectangular hole	mm
a ₁	amplitude of the light wave	
ъ	semi-minor axis of an elliptic hole	mm
b'	length of a rectangular hole	mm
c	semi-focal length	mm
d	width of a calibrated specimen	mm
D	width of a plate	mm
е	base of natural logarithm	
f	material fringe constant	N/mm-order
F	model fring constant	N/mm ² order
h	thickness of specimens	mm
k	stress optical constant	
k ₁	function of c/r	
k ₂	function of c/r	
Ka	constant	
K _b	constant	
K _F	stress concentration factor	
m	ratio of semi-focal length to radius of	
	curvature, c/r	
n	fringe order	
NO	reflective index of light through the med	dium
N ₁	reflective index on no. 1 principal plane	

SYMBOLS	DESCRIPTION	UNIT
N ₂	reflective index on no. 2 principal plane	
P	load applied to a specimen	N
r	radius of curvature	mm
S	intensity of distributed load	N/mm ²
so	light source	
t	time	
t ₁	time lag on no. 1 principal plane	
t ₂	time lag on no. 2 principal plane	
¥	velocity of light through the medium	
v ₁	velocity of light through no. 1 principal	
	plane	
v ₂	Velocity of light through no. 2 principal	
	plane	
W	Weight	lff
π	constant equal to 3.141592654	
w	angular velocity of light	
9	angle between a plane of palarized light	
	and no. 1 principal plane	
B	inclination angle of a slit	degree
η	a variable for an elliptic coordinate ($\eta = 0$	
· ·	on X - axis)	
3	a variable for an elliptic coordinate	
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	geometrical constant of an elliptic hole	

SYMBOLS	DESCRIPTION	UNIT
61	maximum principal stress on no. 1 principal	
	plane	N/mm ²
62	minimum principal stress on no. 2 principal	
	plane	N/mm^2
6,	normal stress in the direction tangent to	
	the slit's boundary	N/mm^2
(6n) =	stress around an elliptic hole	N/mm ²
	stress at the end of an elliptic hole	N/mm ²
Δ	increment change	
δ_1	change in reflective index on no. 1 principal	
	plane	
δ_2	change in reflective index on no. 2 principal	
	plane	